

<<数字电路典型实验范例剖析>>

图书基本信息

书名：<<数字电路典型实验范例剖析>>

13位ISBN编号：9787115124029

10位ISBN编号：7115124027

出版时间：2004-7

出版时间：第1版 (2004年1月1日)

作者：赵博

页数：158

字数：248000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<数字电路典型实验范例剖析>>

内容概要

本书为配合数字电路课程的教学以及教学改革而编写，目的在于强化动手能力、创新能力的培养和提高。

本书分为“基础知识”、“单元实验”和“课程设计”3部分。

第一部分基础知识简要介绍了数字电路设计的相关器件（单片机、DSP、嵌入式系统、可编程器件），使初学者对这些器件的开发有大致地了解。

第二部分单元实验包括基本门特性分析、TTL电路单元实验，时序/组合逻辑实验。

第三部分课程设计包括了GAL和TTL的综合实验、高密度可编程器件CPLD实验、单片机、DSP实验等内容，突出EDA技术的设计思想。

本书可作为高等学校计算机、电子、通信、自动化等专业的配套辅助教材，亦可作为相关专业课教师及实验室技术人员的参考书。

<<数字电路典型实验范例剖析>>

书籍目录

第一部分 基础知识 第1章 数字电路主要硬件简介 1.1 单片机简介 1.1.1 单片机的历史、现状及未来
1.1.2 单片机的组成 1.1.3 单片机的开发 1.1.4 EM78P447单片机简介 1.2 DSP简介 1.2.1 DSP芯片的特点
1.2.2 DSP在结构上的几大优势 1.2.3 DSP芯片的发展现状及其应用 1.2.4 DSP程序开发 1.3 嵌入式系统
(Embedded System) 1.3.1 嵌入式系统的定义 1.3.2 嵌入式系统的历史 1.3.3 嵌入式系统的特点 1.3.4
嵌入式系统的分类 1.4 可编程器件简介 1.4.1 可编程逻辑器件的概念 1.4.2 可编程逻辑器件与专用集成
电路 1.4.3 可编程逻辑器件的种类 1.4.4 可编程逻辑器件的发展动态 1.4.5 PLD技术和其他技术的比较
1.5 通用阵列逻辑GAL的结构与特点 1.5.1 通用阵列逻辑GAL的特点 1.5.2 通用阵列逻辑的技术指标
1.5.3 通用阵列逻辑的结构和工作原理 1.5.4 输出逻辑宏单元 (OLMC) 1.6 可编程阵列逻辑器
件EPM7128简介 1.7 电路板制作工具Protel简介 1.7.1 DXP软件介绍 1.7.2 Protel软件的发展历史 1.7.3
PCB板设计的工作流程 1.8 MAX + plus 软件介绍 1.8.1 MAX + plus 的功能特点 1.8.2 MAX + plus
的系统要求 1.8.3 MAX + plus 的设计流程第二部分 单元实验 第2章 TTL单元电路实验 实验一 门电路
的特性分析 实验二 特殊门电路的特性分析与设计 实验三 可控码制转换器的设计与实现 实验四 减法
器和加法器的设计与实现 实验五 可控五进制计数器的设计与实现 实验六 1011序列检测器的设计与实
现 实验七 流水灯的设计与实现第3章 通用阵列逻辑GAL实验 实验八 门电路设计与实现 实验九 组合
逻辑电路的设计与实现 (一) 实验十 组合逻辑电路的设计与实现 (二) 实验十一 可控计数器的设计
与实现第三部分 课程设计 第4章 TTL与GAL综合实验 第5章 高密度可编程器件CPLD实验 第6章 单片机
实验 第7章 DSP实验

<<数字电路典型实验范例剖析>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>